Res'd PCT/PTO 23 JUN 2005

PCT/JP 2004/003951

23. 3. 2004 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

3月25日 2003年

REC'D 13 MAY 2004

WIPO

PCT

出 願 Application Number:

特願2003-083335

[ST. 10/C]:

[JP2003-083335]

出 人 Applicant(s):

信越ポリマー株式会社

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

4月22日 2004年



Best Available Copy

【書類名】 特許願

【整理番号】 N02-135

【提出日】 平成15年 3月25日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H05K 9/00

【発明の名称】 電磁波吸収体

【請求項の数】 7

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋本町4丁目3番5号 信越ポリマー

株式会社内

【氏名】 川口 利行

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋本町4丁目3番5号 信越ポリマー

株式会社内

【氏名】 藤木 弘直

【特許出願人】

【識別番号】 000190116

【氏名又は名称】 信越ポリマー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100108578

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】

100089037

【弁理士】

渡邊 隆 【氏名又は名称】

【選任した代理人】

【識別番号】

100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】

100094400

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】

100107836

【弁理士】

【氏名又は名称】 西 和哉

【選任した代理人】

【識別番号】

100108453

【弁理士】

【氏名又は名称】 村山 靖彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

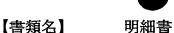
【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0205686

【プルーフの要否】

要



【発明の名称】 電磁波吸収体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機高分子からなる基体上に、強磁性体を物理的に蒸着してなることを特徴とする電磁波吸収体。

【請求項2】 有機高分子の剪断弾性率が $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^8$ Paであることを特徴とする請求項1記載の電磁波吸収体。

【請求項3】 有機高分子基体上に物理的に蒸着された強磁性体の厚みが0.5~200nmであることを特徴とする請求項1または2記載の電磁波吸収体。

【請求項4】 比重が1.5以下であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項記載の電磁波吸収体。

【請求項5】 有機高分子からなる基体上に、ミラートロンスパッタリング 法で強磁性体を物理的に蒸着してなることを特徴とする請求項1~4のいずれか 1項記載の電磁波吸収体。

【請求項6】 請求項1~5のいずれか1項記載の電磁波吸収体を複数層積 層してなる積層電磁波吸収体。

【請求項7】 有機高分子基体上に物理的に蒸着された強磁性体の合計厚みが500nm以下であることを特徴とする請求項6記載の積層電磁波吸収体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、強磁性体を用いた電磁波吸収体に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、インターネット利用をはじめとして、携帯電話あるいは携帯情報端末、 高度道路情報システム、ブルートゥースなど電波を利用した情報通信機器が普及 してきており、ユビキタス社会が訪れてきている。しかし、これら情報機器の普 及に伴って、これら情報機器から放射される電磁波がもたらす、他の電子機器へ



そのため、電子機器には、誤作動を起こしたり、他の電子機器や人体に影響を与えないように、電磁波をできるだけ放出しないこと、外部から電磁波を受けても誤作動しないことが求められ、電子機器に対し、電磁波を反射あるいは吸収する電磁波遮蔽を施すことが行われている。

[0003]

電子機器、特に携帯可能な電子機器は、多機能、高性能化、小型化、軽量化が 求められ、電磁波吸収においても同様で、堅牢で吸収効率がよく、小スペースで 軽量であるものが求められている。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

従来より行われている導体シールドでは、不要輻射源からの反射による電磁結合が助長されるので、磁性体の磁気損失、すなわち虚数部透磁率 μ "を利用した不要輻射の抑制が有効であるとして、軟磁性体扁平粉の厚みが表皮深さより薄く、充分なアスペクト比を有し、磁性体表面を不導体化した磁性体粉を有機結合剤中に約95質量%加えてなる、効率のよい電磁波吸収特性を有し、可撓性を有する電磁波吸収体の提案がある(例えば、特許文献 1 参照。)。この実施例においては評価にあたって銅板で裏打ちされた電磁波吸収体を用いており、この電磁波吸収体の厚みは測定用銅板込みで 2 mmとされている。

[0005]

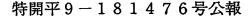
また、強磁性元素とセラミック元素をマグネトロンスパッタリングで基板上に製膜し、低温でアニールすることにより高抵抗のセラミック層中に強磁性体からなる超微結晶を析出させ、アイソレートしてなる電磁波吸収体の提案があり、100MHz~10GHzの高周波帯域で、電気抵抗が高く、渦電流による電磁波の反射が抑えられ、虚数部透磁率が大きいため優れた電磁波吸収特性を有するとされている(例えば、特許文献2参照。)。

[0006]

【特許文献 1 】

特開平9-93034号公報

【特許文献2】



[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、特許文献1記載の電磁波吸収体はその厚みが銅板込みで2mmであり、電磁波吸収体自体のシート厚みは1mm以上と厚く、しかもその95質量%が鉄などの強磁性体からなるので重く、軽量化が達成されたとはいえない。また、有機結合剤の量が少ないので堅牢性、可撓性も充分とはいえない。さらに、軟磁性体粉の扁平化や表面の不導体化に手間を要するため軟磁性体扁平粉は高価なものとなり、これを多量に用いるので電磁波吸収体も高価なものとなり、産業上満足のいくものではなかった。

また、特許文献2には、セラミック相と強磁性超微結晶相とを含んでなる超微結晶磁性膜からなる電磁波吸収体の提案がある。この電磁波吸収体においては、セラミック相中に強磁性超微結晶を生成させるためには高温の熱処理が必要とされている。特許文献2の実施例ではスライドガラス上にRFマグネトロンスパッタ法でセラミック/強磁性元素の膜を製膜し、200~350℃の熱処理をして強磁性超微結晶を形成させている。特許文献2では有機フィルム上に作製することを考慮しているものの、有機フィルムとしては高耐熱有機フィルムを用いざるを得ない。高耐熱有機フィルムは価格が高く、高価なものとなる。さらに、仮に高耐熱有機フィルム上にこのような強磁性超微結晶相を形成させたとしても、有機フィルムと生成されたセラミックスとでは熱膨張率に大きな差があり、クラックが生じやすく、可撓性や堅牢性が高いというものではない。

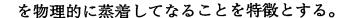
このような状況から、電子機器や電子部品などに、組み込み応用が容易で、電磁波吸収特性が良く、小型、軽量で、可撓性があり、堅牢な電磁波吸収体は、未だ満足のいくものがなく、求められている。

[0008]

【課題を解決するための手段】

上記状況に鑑み、本発明者らは、強磁性体の超微粒子分散を検討し、電磁波吸収特性に優れ、小型、軽量で可撓性があり、堅牢な電磁波吸収体に到達した。

すなわち、本発明の電磁波吸収体は、有機高分子からなる基体上に、強磁性体



また、本発明の積層電磁波吸収体は、前記電磁波吸収体を複数層積層してなることを特徴とする。

[0009]

【発明の実施の形態】

本発明で用いられる強磁性体としては、金属系軟磁性体および/または、酸化物系軟磁性体が主に用いられるが、金属系軟磁性体と酸化物系軟磁性体は1種単独で用いてもよいし、この両者を混合して用いてもよい。

金属系軟磁性体としては、鉄および鉄合金が好ましい。

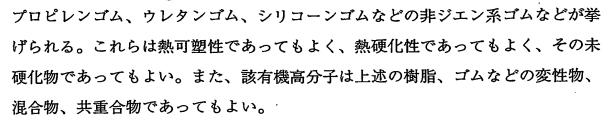
鉄合金として具体的にはFe-Ni、Fe-Co、Fe-Cr、Fe-Si、Fe-Al、Fe-Cr-Si、Fe-Cr-Al及びFe-Al-Si合金を用いることができる。これらの金属系軟磁性体は1種単独で用いてもよいし、2種以上の組合せを用いてもよい。鉄および鉄合金のほかにコバルトやニッケルの金属あるいはそれらの合金を用いてもよい。

[0010]

酸化物系軟磁性体としてはフェライトが好ましい。具体的にはMnFe₂O₄、CoFe₂O₄、NiFe₂O₄、CuFe₂O₄、ZnFe₂O₄、MgFe₂O₄、Fe₃O₄、Cu-Zn-フェライト、Ni-Zn-フェライト、Mn-Zn-フェライト、Ba₂Co₂Fe₁2O₂2、Ba₂Ni₂Fe₁2O₂2、Ba₂Zn₂Fe₁2O₂2、Ba₂Mn₂Fe₁2O₂2、Ba₂Mg₂Fe₁2O₂2、Ba₂Cu₂Fe₁2O₂2、Ba₃Co₂Fe₂4O₄1を用いることができる。これらのフェライトは1種単独で用いても良いし、2種以上を組合せて用いてもよい。

[0011]

有機高分子基体として用いられる有機高分子は、ポリオレフィン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリケトン系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリシロキサン系樹脂、フェノール系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂や、天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴムなどのジエン系ゴム、ブチルゴム、エチレン



[0012]

本発明の電磁波吸収体は、有機高分子からなる基体上に、強磁性体超微粒子が、基体である有機高分子の表層から数ミクロン、例えば $\sim \mu$ mの範囲にわたり分散していることが好ましい。すなわち、有機高分子基体への強磁性体の物理的蒸着時に、強磁性体超微粒子が有機高分子内に侵入あるいは強磁性体超微粒子の衝突による有機高分子の変形や流動により有機高分子表層の数ミクロンの層にわたり分散することが好ましい。そのため、該有機高分子としては、その剪断弾性率が低いものがよく、 $1\times10^4\sim1\times10^8$ (Pa)、好ましくは $1\times10^4\sim1\times10^7$ (Pa)、さらに好ましくは $1\times10^4\sim1\times10^6$ (Pa)とされる。これらに該当する有機高分子としては、おおよそゴム硬度 90° (JIS-A)以下の弾性体が挙げられる。

[0013]

また、飛ばされた強磁性体原子が入り込みやすい分子間空隙の広さを示す指標として、ガス透過率を用いることができる。本来は、前記した強磁性体元素の大きさに等しいアルゴンガス、クリプトンガスが透過率を確認することに都合がよいが、ガス透過率の測定には一般的でないため、例えば炭酸ガスの透過率データで代用することができる。この炭酸ガス透過率の大きなものとして、 1×10^-9 $\{cm^2(STP)(cm\times sec\times cmHg)^{-1}\}$ 以上のポリフェニレンオキサイド、ポリメチルペンテン、ナイロン11、ハイインパクトポリスチレンなどのゴム成分との混合物や共重合物、 1×10^{-8} $\{cm^2(STP)(cm\times sec\times cmHg)^{-1}\}$ 以上のポリブタジエン、ポリイソプレン、スチレンプタジエンゴム、シリコーンゴムなどが挙げられる。剪断弾性率の点からもシリコーンゴムなどのゴム類は特に好ましい。

[0014]

また、有機高分子表面に物理的な凹凸を付加的に加工することがよい。その平



この凹凸付加加工にあたっての加工法は特に限定されるものではないが、例えば、サンドプラスト、エッチングなどや、粗面の転写により形成する方法が挙げられる。

さらに、発泡体は内部に空隙を有するため、都合がよく、微細なセルで、連続気泡になっており、表面にスキン層のないものがよい。セル径がおおよそ100 μ m以下、好ましくは50 μ m以下の発泡体が好ましい。空孔率は $5\sim50$ %程度が好ましい。

[0015]

該有機高分子はフィルムとして用いられ、その膜厚は薄い方がよく、 $1\sim20$ $0~\mu$ m程度とされる。有機高分子のフィルムが単独では薄くてハンドリングできない場合は、別にキャリヤーを設けてもよい。

薄い膜厚を形成するには、製膜材料の流動性の大きいことがよく、有機高分子 を溶剤に溶解した溶液を製膜してもよく、有機高分子が単独で流動性を有する場合は無溶剤で製膜してもよい。

[0016]

図1に、有機高分子基体上に強磁性体が物理的に蒸着された状態の模式図を示す。図1は、有機高分子基体(1)上に強磁性体(2)が物理的に蒸着されているが、強磁性体(2)は有機高分子基体(1)の中に部分的に潜り込んだ状態となり、強磁性体が三次元的に偏在しており、均質膜を形成していない状態となっていることを示している。強磁性体が、直接、超微粒子化された状態で分散されているため、再加熱等による強磁性体の再結晶をはかる必要がない。

強磁性体(2)として金属軟磁性体が均質膜を形成するように蒸着されていると、金属軟磁性体の固有抵抗が小さいので、渦電流が発生して、強磁性体の電磁波吸収効果がなくなり、むしろ反射機能がでてくるため、電子回路や電子部品からの電磁波を吸収できずに、反射してしまい、電子回路等に逆に影響を与えてしまう。したがって、金属軟磁性体を有機高分子基体(1)上に物理的に蒸着する場合は、均質な強磁性体膜を形成しないようにすることがよい。膜の表面抵抗(直流抵抗)はおおよそ 1×10^{10} Ω / \square であることが好ましい。

後述する物理蒸着法により原子状態になった強磁性体元素は、おおよそ数点のサイズであるが、有機高分子は、金属やセラミックスと異なり分子間に空隙を有しており、飛ばされた強磁性体原子は、この空隙に入りこむため、一平面に堆積して薄膜を形成することがなく、三次元的に偏在するため、蒸着量が少ない場合は、超微粒子が独立して、良導通を示さない状態になり易い。

図1に示すように、強磁性体(2)の超微粒子が有機高分子基体(1)の内部に深く入り込むと、一度の蒸着で蒸着量が多くても容易に偏在し、均質膜となることがなく、高い抵抗を維持することことができる。

したがって、超微粒子が有機高分子に深く入り込むことが強磁性体膜の形成効率を高める上で好都合である。

前述のように有機高分子の剪断弾性率が低いと、分子が容易に変形するので超 微粒子が深く入り込みやすい。前記有機高分子のガス透過率が高い場合や、発泡 体も同様の効果を示す。

[0017]

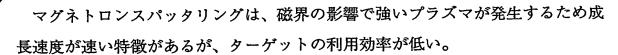
物理蒸着法(PVD)での各種成膜方法は、真空にした容器の中で薄膜形成物質を何らかの方法で気化させ、近傍に置いた基板上に堆積させて薄膜を形成する方法である。

物理蒸着法を薄膜物質の気化方法で分類すると、蒸発系とスパッタ系に分けられ、蒸発系にはEB蒸着、イオンプレーティング、スパッタ系にはマグネトロンスパッタリング、ミラートロンスパッタリングなどが挙げられる。

[0018]

EB蒸着は、蒸発粒子のエネルギーが1eVと小さいので、基板のダメージが 少なく、膜がポーラスになりやすく、膜強度が不足する傾向があるが、強磁性体 膜の固有抵抗は高くなるという特徴がある。

イオンプレーティングはアルゴンガスや蒸発粒子のイオンは加速されて基板に 衝突するため、EBよりエネルギーは大きく、付着力の強い膜を得ることができ る。しかし、ドロップレットと呼んでいるミクロンサイズの粒子が多数付着して しまうと放電が停止してしまう。また、酸化物系強磁性体を成膜するには、酸素 などの反応性ガスを導入しなければならず、膜質コントロールが難しい。



[0019]

ミラートロンスパッタリングは、対向するターゲット間でプラズマを発生させ、対向するターゲットの外に基板を置き、プラズマダメージを受けることなく所望の薄膜を生成する方法である。そのため、基板上の薄膜を再スパッタすることなく、成長速度がさら速く、スパッタされた原子が衝突緩和することがない。

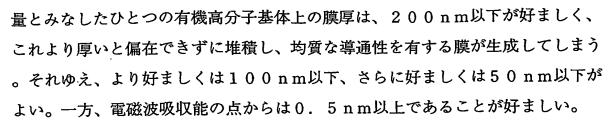
したがって、代表的な有機の共有結合エネルギーは約4 e Vであり、C-C、C-H、Si-O、Si-Cの結合エネルギーはそれぞれ3.6、4.3、4.6、3.3 e Vであるのに対して、ミラートロンスパッタでスパッタされた原子は8 e V以上と高いエネルギーを持っている。

ミラートロンスパッタでは、このように高いエネルギーを持っているので、有機高分子の種類にもよるが、スパッタ後の基体表面には例えば 5 μ m程度の凹凸が形成され、強磁性体原子が、有機高分子基体の表面からおおよそ3~10μm程度まで進入することができる。これは高エネルギーの強磁性体原子の基体表面への衝突により強磁性体原子と有機高分子の局部的なミキシングが生じたためと推測される。このような現象が生ずることにより、前記した強磁性超微粒子の偏在をもたらすことができ、一度の大量の強磁性体を分散させることができるので好ましい。すなわち、一度の蒸着で、強磁性体の質量を稼ぐことができることから、吸収減衰率の大きな吸収体を容易に得ることができるため、好ましい。

また、特に、強磁性体をスパッタする場合は、マグネトロンスパッタでは磁力 線が強磁性体ターゲット中を通るのでターゲットの厚みによってスパッタレート が決まったり、放電がおきにくくなったりするのに対し、磁場をターゲットのス パッタ面に垂直に印加するため、強磁性体をターゲットに用いても磁場が保持さ れ、ターゲットの厚さに関係なく高速スパッタができるという特徴を有する。

[0020]

膜厚は、膜厚計で測定できるが、膜の密度あるいは有機高分子基体の内部に侵入し、偏在していることから、該基体上にある膜の厚さ(蒸着により増加した堆積厚み)とは等しくなく、被着させた強磁性体の量と見るのが正しい。この被着



しかし、過度に膜厚が薄くなると、吸収能力が低減するものであるから、蒸着された高分子基体を複数層積層して積層電磁波吸収体とすることにより、適宜、電磁波吸収体に占める強磁性体の総量を増やすことが好ましい。この総量は吸収レベルにもよるが、おおよそ総合計厚みで10~500nm(みなし膜厚として)がよい。

この膜厚は、物理的蒸着前後での質量増加量を強磁性体の比重と蒸着面積で割った値として求められる。あるいは、ガラス等の硬質基板上に堆積した厚みを測定することによって求められる。

積層電磁波吸収体においては、その積層数は特に限定されるものではないが、 積層電磁波吸収体の全体の厚みを考慮して決められる。物理的蒸着後の、複数積 層した有機高分子基体を含む全体の厚みは、おおよそ20~200μm程度とな るのが好ましい。そのため、有機高分子基体の厚みも積層電磁波吸収体にした時 の全体の厚みを考慮して適宜選択することが好ましい。

また、強磁性体と有機高分子の割合は、強磁性体と有機高分子の体積比を、0.0005:1~0.0025:1程度とすることが好ましく、この場合、その比重は有機高分子だけの場合と比べ、最大でも約数%増しとなり、1.5以下となる。それ故、強磁性体の量が相対的に少ないため、有機高分子の特性を維持し、十分な機械物性を保持できる。

積層電磁波吸収体においては、各層を形成する電磁波吸収体の強磁性体の厚み は同一であってもよいが、各層ごとに強磁性体の厚みを変えてもよい。

例えば、電磁波吸収能力があるといえども、ある程度の反射が起こり、電磁波 を放射した電子回路や電子部品に影響を与えることがあるので、積層する各層の 強磁性体のみなし厚みを、電子部品側の層から徐々に増して、傾斜的に配置する など、極力反射を抑えることも可能である。

[0021]



以下に、実施例を用いて、本発明をさらに詳しく説明する。

(評価)

なお、実施例、比較例で得た電磁波吸収体の電磁波吸収特性は、図2に示す方法で、近傍界の吸収を測定周波数2GHzで吸収減衰率と反射による影響度を測定した。ネットワークアナラーザーは、アンリツ製ベクトルネットワークアナライザー37247Cを用いた。

(実施例1)

有機高分子基体として 12μ m厚のポリエチレンテレフタレートフィルム(剪断弾性率 3.8×10^9 (Pa)、炭酸ガス透過率 1×10^{-11} cm^2 (STP)($cm\times sec\times cmHg$) $^{-1}$ 、平均表面粗さ 1.8μ m)上に、Mn-2n系高透磁率フェライト3nmを、ミラートロンスパッタ法によりスパッタした。強磁性体の表面抵抗を注意深く直流4端子法で測定し、所望の大きさに整え、10枚にポリエステル系接着剤を挿み、真空プレスで一体化して、総厚 138μ mの電磁波吸収体を得た。次いで、比重と電磁波吸収特性を測定した。

. [0022]

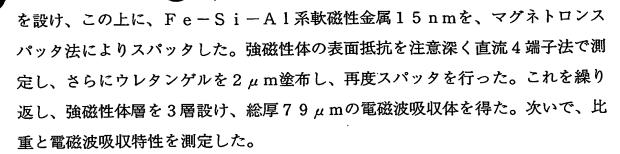
(実施例2)

 25μ m厚のポリエチレンテレフタレートフィルム上に、有機高分子基体として 20μ m厚のシリコーンゴム(剪断弾性率 1×10^7 (Pa)、炭酸ガス透過率 2.2×10^{-7} {cm² (STP) (cm×sec×cmHg) $^{-1}$ })を設け、この上に、Fe-Ni系軟磁性金属20nmを、ミラートロンスパッタ法によりスパッタした。強磁性体の表面抵抗を注意深く直流 4 端子法で測定し、所望の大きさに整え、総厚 45μ mの電磁波吸収体を得た。次いで、比重と電磁波吸収特性を測定した。

[0023]

(実施例3)

 25μ m厚のポリエチレンテレフタレートフィルム上に、有機高分子基体として 10μ m厚のウレタンゲル(剪断弾性率 1.7×10^6 (Pa)、炭酸ガス透過率 5.3×10^{-8} {cm² (STP) (cm×sec×cmHg) $^{-1}$ })



[0024]

(実施例4)

マグネトロンスッパタ法に代えて、ミラートロンスパッタ法を用いたこと以外、実施例3と同様にしてFe-Si-Al系軟磁性金属15nmをスパッタして、強磁性体層を3層設け、総厚79μmの電磁波吸収体を得た。

[0025]

(比較例1)

扁平状のFe-Ni系軟磁性金属粉(平均粒径 15μ m、PZペクト比65) 94重量部に、ポリウレタン樹脂 5重量部、硬化剤としてイソシアネート化合物 1重量部、溶剤(シクロヘキサノンとトルエンの1:1混合物) 30重量部を加えたペーストを乾燥後の厚みが1.1mmとなるよう、バーコート法で塗布して膜を形成し、十分乾燥させた後、真空加熱プレスし、85℃で24時間キュアリングして膜厚1mmの電磁波吸収体を得た。次いで、比重と電磁波吸収特性を測定した。

[0026]



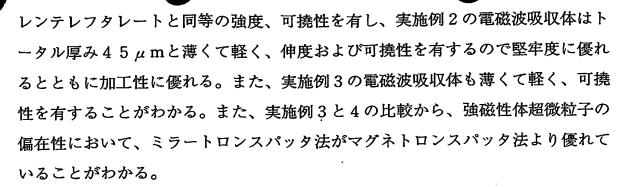
	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例1
キャリヤー	なし	PET	PET	PET	
キャリヤー厚み(μm)	-	25	25	25	
有機高分子基体	PET	シリコーン	ウレタン	ウレタン	
		ゴム	ゲル	ゲル	
基体のせん断弾性率(Pa)	3. 8E+9	1E+7	1. 7E+6	1. 7E+6	
炭酸ガス透過率	1E-11	2. 2E-7	5. 3E-8	5. 3E-8	
$[cm^2(STP)(cm \times sec \times cmHg)^{-1}]$					
基体の厚み(µm)	12	20	10	10	
強磁性体	Mn-Zn 系	Fe-Ni	Fe-Si-Al	Fe-Si-Al	Fe-Ni
	フェライト				
強磁性体厚み(nm)	3	20	15	15	1E+6
物理蒸着法	ミラートロ	ミラートロ	マグネトロ	ミラートロ	_
	ン	ン	ン	ン	
強磁性体表面抵抗(Ω/口)	3E+7	2E+2	1E+3	4E+5	1E+6
積層数	10	1	3	3	_
中間接着剤厚み(μm)	2	_	2	2	_
トータル厚み(μm)	138	45	79	79	1000
トータル強磁性体厚み(nm)	30	20	45	45	
比重	1. 3	1. 2	1. 2	1. 2	6. 1
吸収減衰率(dB)	-7	-8	-15	-18	-6
(測定周波数 2GHz)					
反射による影響度(dB)	-20	-10	-12	-14	-8
(測定周波数 2GHz)					
破断強度(MPa)	205	10. 5	21	21	2. 5
破断伸び(%)	149	450	687	687	7
外観	有機高分	薄く軽い	薄く軽い	薄く軽い	重く、脆い
	子基体同	伸びる	可撓性が	可撓性が	
	様の強度		ある	ある	
	を有する				
判定	0	0	0		· ×

[0027]

なお、表1において、比重はキャリヤー込みの値である。(有機高分子基体としてPETを用いた場合はPET付で測定)

破断強度・伸びはキャリヤーなしで測定。

表1から、電磁波吸収特性は実施例1~4、比較例1もほぼ同等であるが、比較例1の電磁波吸収体は比重が6.1と重く、脆いため、衝撃がかかった場合に壊れやすいものであるのに対し、実施例1の電磁波吸収体は基体であるポリエチ



[0028]

【発明の効果】

本発明によれば、電磁波吸収特性が良く、小型、軽量で、可撓性があり、堅牢な電磁波吸収体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機高分子基体上に強磁性体が物理的に蒸着された状態の模式図を 示す図である。

【図2】電磁波吸収体の電磁波吸収特性の測定方法を示す概略図である。

【符号の説明】

1:有機高分子基体

2:強磁性体

3:電磁波吸収体

4:テストフィクスチャー

5:ネットワークアナライザー

6:銅箔パターン

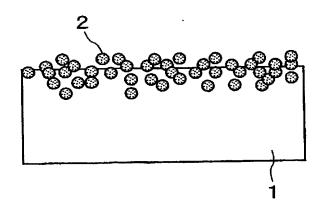
7:絶縁フィルム



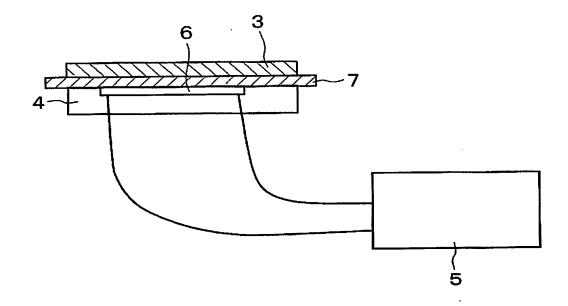
【書類名】

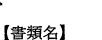
図面

【図1】



【図2】





要約書

【要約】

【課題】 電磁波吸収特性が良く、小型、軽量で、可撓性があり、堅牢な電磁波吸収体を提供する。

【解決手段】有機高分子からなる基体上に、強磁性体を物理的に蒸着してなることを特徴とする電磁波吸収体、および、電磁波吸収体を複数層積層してなる積層電磁波吸収体。

【選択図】 図1



認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-083335

受付番号 50300483724

書類名 特許願

担当官 第四担当上席 0093

作成日 平成15年 3月26日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000190116

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋本町4丁目3番5号

【氏名又は名称】 信越ポリマー株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100064908

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100108578

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】 100089037

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

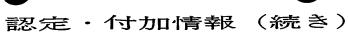
【識別番号】 100094400

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

次頁有





【氏名又は名称】 鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】 100107836

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 西 和哉

【選任した代理人】

【識別番号】 100108453

【住所又は居所】 東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】 村山 靖彦



特願2003-083335

出願人履歴情報

識別番号

[000190116]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所 名

東京都中央区日本橋本町4丁目3番5号

信越ポリマー株式会社